

# 上海伟测半导体科技股份有限公司

2023-08-24

上海伟测半导体科技股份有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海伟测半导体科技股份有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区东胜路38号A2, D1厂区	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素 0 个, 物理因素 30 个, 生物因素 0 个, 合格的检测点位30 个, 不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 30 , 不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查: 孙燕莉、王达清  采样: 陈宇俊、姜蔚  检测:
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 郝为峰  陪同人员: 郝为峰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间: 2023.8.14  采样时间: 2023.8.14  检测时间: 2023.8.14

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



